

软件技术与数据库

SPC在软件过程度量中的应用及改进

杜庆峰, 马慧珺

(同济大学软件学院, 上海 201804)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 在介绍软件过程度量原理的基础上, 讨论Shewhart控制图的构成和分析方法。结合实例, 分析统计过程控制在软件过程度量中的作用。针对传统Shewhart控制图无法区分软件过程之间影响的缺陷, 借助选控图理论对现有方法在软件过程度量中的不足提出改进。有效区分软件过程的相互作用, 定性和定量地分析软件过程的稳定性和性能。

关键词 [软件过程度量](#); [统计过程控制](#); [选控图](#)

分类号 [TP311](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: 杜庆峰; 马慧珺

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (128KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“软件过程度量; 统计过程控制; 选控图”的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)